

## 9T PPMS 可変温度抵抗システム

製造元	Quantum Design, Inc.	
仕様	汎用型物性測定装置 温度範囲 1.9 K ~ 350 K、磁場範囲 0 ~ 9 T 測定オプション <ul style="list-style-type: none"> <li>● 直流抵抗 (DC)             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 抵抗測定範囲 : 10 <math>\mu\Omega</math> ~ 5 M<math>\Omega</math> (4端子法)</li> <li>➢ 電流範囲 : 2 nA ~ 8 mA</li> </ul> </li> <li>● 比熱測定 (HC)             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 緩和法、試料サイズ : 1 ~ 500 mg、分解能 : 10 nJ/K@2 K</li> <li>➢ 測定精度 : <math>\pm 5\%</math> (2 ~ 300 K)</li> </ul> </li> </ul>	 DC puck   HC puck
保有部署	材料化学専攻 藤田研究室	
設置場所	桂・A2棟・B1階インキュベーションコアラボ	
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 <a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/</a>	
注意事項等	DC パックは 2 点のみ利用可、ACT パック (高精度ホール測定用) は要持参	
連絡先	材料化学専攻 藤田研究室 ( <a href="https://www1.kuic.kyoto-u.ac.jp/ja/">https://www1.kuic.kyoto-u.ac.jp/ja/</a> ) 管理責任者 : 藤田 晃司 <a href="mailto:fujita.koji.5w@kyoto-u.ac.jp">fujita.koji.5w@kyoto-u.ac.jp</a> ; 075-383-2432 機器担当者 : 衣 瑋 <a href="mailto:yi.wei.5c@kyoto-u.ac.jp">yi.wei.5c@kyoto-u.ac.jp</a> ; 075-383-2418 小畑 由紀子 <a href="mailto:obata.yukiko.7w@kyoto-u.ac.jp">obata.yukiko.7w@kyoto-u.ac.jp</a> ; 075-383-2411	
キーワード	電気抵抗、ホール、磁気抵抗、比熱、	
機器コード	0000115019	
自由記入欄	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 専用のサンプルパックにより、容易に試料の取付が可能</li> <li>✓ 他の測定機器やプログラムとの組み合わせが可能な柔軟なシステム</li> </ul>	